DEVELOPMENT OF SIX-ELECTRODE BPM SYSTEM IN SPring-8 LINAC

Kenichi Yanagida*, Shinsuke Suzuki, Takemasa Masuda and Hirofumi Hanaki, Japan Synchrotron Radiation Research Institute / SPring-8

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198

Abstract

For an enhancement of beam observation system during the top-up operation the non-destructive beam position monitor (BPM) system is being upgraded to which can measure second-order moments in the SPring-8 linear accelerator. Equipments, i.e., BPMs, a signal processor and a digital input device, were developed so as to be suited for a high resolution six-channel parallel data acquisition with no requirement for additional physical spaces. The developed equipments are six-electrode BPMs with circular and quasi-elliptical cross section, a low noise six-channel signal processor and an OPT-VME 128-bit digital input board. A resolution of the BPM system is designed as $\sim 2 \ \mu m$ for first-order, $\sim 20 \ \mu m^2$ for second-order and $\sim 200 \ \mu m^3$ for third-order moments. From a result of beam test normalized moments of the BPM with circular cross section showed good agreement with the theory.

SPring-8線型加速器六電極 BPM システムの開発

1. はじめに

SPring-8線型加速器では、主にトップアップ運転時の ビーム監視機能を増強させるため、非破壊型六電極ビー ム位置モニタ(BPM)システムを整備している。1台の 六電極 BPM を使用した場合、ビーム広がり(サイズ) に関する物理量である二次モーメントが測定可能であ る。複数地点に設置された六電極 BPM から得られる複 数地点の二次モーメントを測定すれば、分散部、非分 散部を問わずビームサイズを演繹することも可能とな る^[1]。

昨年の年会に於いて、SPring-8 線型加速器では二次 モーメント測定用円形断面六電極 BPM が設計・製作さ れ、設置されることが報告された^[2]。六電極 BPM のシ ステムは既存の四電極 BPM のシステムに比ベチャンネ ル数が 1.5 倍となり、システムの拡張が必要となった。 但し、空間の拡張性が殆ど無い機器設置場所が存在する ため、全データ取得系を空間の拡張を伴わずに 4 系統 から 6 系統へ系統数のみ拡張することとした。

新規に開発された機器は円形及び准楕円形断面六電 極 BPM、六回路 BPM 信号処理回路及び OPT-VME128 ビットディジタル入力ボードである。ビームの二次モー メントを精度良く測定する為には、信号処理回路は低ノ イズである必要があり、既存の四回路信号処理回路より 一桁程度ノイズレベルの低い信号処理回路を開発した。

本年会ではこれら六系統を有する機器の開発状況を 述べると共に、円形断面六電極 BPM の特性を確認する ために行ったビーム試験の結果に就いて述べる。

2. 円形及び准楕円形断面六電極 BPM

図1は昨年報告した円形断面六電極 BPM の写真で ある。ダクト半径は16 mm で、ストリップライン長は 27 mm である。ストリップライン形状は全て同一であ り、特性インピーダンスは50Ωで設計されている。ダ クト中心(機械中心)からの各電極の占有角(見込み 角)は30°である。 円形断面六電極 BPM は 2010 年度に 3 台納入され、 2011 年 8 月に L4 ビーム輸送系内の円形断面四電極 BPM^[3]3 台と置き換えられた。目的は二次モーメント を測定し、ビームの Twiss パラメータ等の再現性を監視 するためである。



図 1: 円形断面六電極 BPM (写真)

図2及び図3は准楕円形断面六電極 BPM の写真及び 図面である。機械加工を容易にするため、断面は楕円 形では無く、4つの円弧からなる准楕円とした。准楕円 の長半径及び短半径は28 mm 及び14 mm で、ストリッ プライン長は27 mm である。ストリップライン形状は 2 種類あるが、特性インピーダンスは50 Ω で、ダクト 中心(機械中心)からの各電極の占有角(見込み角)は 30°で設計されている。

准楕円形断面六電極 BPM は 2011 年度に 2 台納入さ れ、2012 年 7 月にシケイン部及び LS ビーム輸送系分 散部の准楕円形断面四電極 BPM^[4]2 台と置き換えられ た。目的は二次モーメントを測定し、ビームのエネル ギー広がり($\Delta E/E$)を監視するためである。

3. 絶対モーメントと規格化モーメント

ダクト中心(機械中心)を原点とするn次モーメントは絶対n次モーメント(nは自然数)と呼ばれる。図 1及び図2の様な六電極 BPM に於いて測定可能な絶対 モーメントは P_1 、 Q_1 、 P_2 、 Q_2 及び Q_3 である^[5]。こ

^{*} ken@spring8.or.jp



図 2: 准楕円形断面六電極 BPM (写真)



図 3: 准楕円形断面六電極 BPM (図面)

れらの絶対モーメントを得るために、各電極からの出力 電圧の差分 C_1 、 S_1 、 C_2 、 S_2 及び S_3 を定義する。各電 極からの出力電圧を $V_d(d = 1, \dots, 6)$ とする場合、

$$C_{1} = \frac{V_{1} - V_{3} - V_{4} + V_{6}}{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6}},$$

$$S_{1} = \frac{V_{1} + V_{3} - V_{4} - V_{6}}{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6}},$$

$$C_{2} = \frac{kV_{1} - 2V_{2} + kV_{3} + kV_{4} - 2V_{5} + kV_{6}}{kV_{1} + 2V_{2} + kV_{3} + kV_{4} + 2V_{5} + kV_{6}},$$

$$S_{2} = \frac{V_{1} - V_{3} + V_{4} - V_{6}}{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6}},$$

$$S_{3} = \frac{KV_{1} - V_{2} + KV_{3} - KV_{4} + V_{5} - KV_{6}}{KV_{1} + V_{2} + KV_{3} + KV_{4} + V_{5} + KV_{6}},$$
(1)

と定義する。 k及び K は表1の通りである。

表 1: <i>k</i> 及び K パラメータ				
	円形断面	准楕円形断面		
	(解析計算)	(数値計算)		
k	1.000	1.918		
K	1.000	3.056		

絶対モーメントと出力電圧差分の比 P_1/C_1 、 Q_1/S_1 、 P_2/C_2 、 Q_2/S_2 及び Q_3/S_3 は幾何学的なパラメータで 規格化モーメント^[5]と呼ばれる。図1及び図2のよう な六電極 BPM に於いては、規格化モーメントは実効開 口半径 R_{Pn} 、 R_{Qn} の関数として式(2)の様に表される。 *R_{Pn}、R_{Qn}* は表 3 の通りである。絶対モーメント *P_n* 及 び *Q_n* を得る式は、式 (2) を変形して式 (3) となる。

$$\frac{P_n}{C_n} = \frac{R_{Pn}^n}{2},$$

$$\frac{Q_n}{S_n} = \frac{R_{Qn}^n}{2}.$$
(2)

	円形断面	准楕円形断面
	(解析計算)	(数値計算)
R_{P1}	18.69	18.03
R_{Q1}	32.38	54.84
R_{P2}	18.91	18.42
R_{Q2}	17.59	22.48
R_{Q3}	16.57	18.55

$$P_n = \frac{R_{P_n}^n}{2} C_n,$$

$$Q_n = \frac{R_{Q_n}^n}{2} S_n.$$
(3)

4. 六回路 BPM 信号処理回路

線型加速器の BPM システムではシングルショットで のデータ取得が行われる。六電極 BPM システムに於い ては6系統の信号処理及びデータ取得が平行して行わ れなければならない。既存システムは4系統であるた め、2系統を新たに追加し、拡張する必要がある。拡張 の方法は2つ有り、一つは機器密度を変えず、旧来の信 号処理回路及びデータ収集系にもう2系統追加する方 法。もう一つは新規の6系統の信号処理回路やデータ 収集系を開発し、機器密度を1.5倍に上げ、旧来機器の スペースに収める方法である。SPring-8線型加速器では 後者の手法を採ることとした。

旧来の四回路 BPM 信号処理回路は NIM2 巾のモジ ュール2台で構成される^[6]。一つはバンドパスフィルター (BPF) モジュールで他方は検波 (Detector) モジュール である。両方共に4系統の信号入出力がある。検波モ ジュール内部は過密状態であるため2系統を追加する 余裕は無く、オフセット調整回路、タイミング遅延調整 回路、サンプルホールド回路、サンプルホールドモニタ 出力、アナログ出力を廃止して2系統分のスペースを 確保した。

サンプルホールド回路を廃止した理由は、それがノイ ズ (バラツキ)の発生原因であったためである。近年、 高速且つ低ノイズの ADC が発売されたため、サンプル ホールド回路の必要性は無くなった。

図4は2011年度に開発された六回路 BPM 信号処理 回路の写真である。対数検波回路としてアナログデバイ ス社の ADL5513が使用されている。出力はディジタル 出力のみとなった。ディジットは四回路 BPM 信号処理 回路と同じ16ビットである。6系統で合計96ビット分 のディジタル出力が必要となるが、ケル社の80ピンコ ネクタ2個で96ビット分を確保している。

四回路 BPM 信号処理回路では±10V のアナログ出力 が存在する。SPring-8 線型加速器では今後も四回路及び 六回路信号処理回路が混在して使用されるため、便宜上 六回路 BPM 信号処理回路のディジタル出力を±10Vの アナログ出力へ換算して使用する。換算は $0x0 \Rightarrow 0.0V$ 、 $0x7FFF \Rightarrow 9.9997V$ 、 $0x8000 \Rightarrow -10.0V$ 及び $0xFFFF \Rightarrow$ -0.0003Vである。CW入力パワーと出力電圧の換算は 四回路 BPM 信号処理回路と同じく $-60dBm \Rightarrow -6V$ 、 $-30dBm \Rightarrow 0V$ 及び $0dBm \Rightarrow 6V$ である。



図 4: 六回路 BPM 信号処理回路(写真)

ADC にはリニアテクノロジー社の LTC-2393-16 が使 用されている。アクイジション時間は 385 ns と高速で 且つ、ノイズレベルは 0.3 bit (typical) と低ノイズであ る。ノイズレベルが 1 ビットより十分小さいため、予想 されるショット毎のバラツキ (測定精度) は 0.5 ビット 程度となる。これは、CW 入力レベルが 0 dBm 程度の 場合、バラツキ (測定精度) w は 1.0×10^{-4} 程度とな ることを示している。測定精度 w は出力電圧差分と同 じ無次元量である。

測定精度 w が決まると、絶対モーメントの分解能は 単純に測定精度 w と規格化モーメント $R_{Pn}^{n}/2$, $R_{Qn}^{n}/2$ の積で求まり、表 3 の様になる。

表 3: 各絶対モーメントの分解能

	円形断面	准楕円形断面
P_1 [μ m]	0.9345	0.9015
Q_1 [μ m]	1.619	2.742
$P_2 \ [\mu m^2]$	17.88	16.96
$Q_2~[\mu { m m}^2]$	15.47	25.27
$Q_3 \ [\mu m^3]$	227.5	319.2

5. 128 ビットディジタル入力ボード

図5は旧来のOPT-VME64ビットディジタル入力(DI) ボード(左側)と新規に開発されたOPT-VME128ビッ トDIボード(右側)の写真である。128ビットDIボー ドは2011年度に開発された。64ビットDIボードでは 入力用に高密度26ピンD-subコネクタが4個が使用さ れていたが、128ビットDIボードでは六回路 BPM 信号 処理回路と同じくケル社の80ピンコネクタが2個使用 されている。六回路 BPM 信号処理回路と128ビットDI ボードとの結線はストレートである。入力ビット数は 96ビットで十分なのであるが、64ビットDI+64ビッ ト DO ボードの DO 部を DI 部へ改造し、全て DI とし たため 128 ビット DI となった。



図 5: OPT-VME64 ビット DI ボード(左側)と OPT-VME128 ビット DI ボード(右側)

6. データベースの信号変更

四電極 BPM を六電極 BPM に置き換えた場合、デー タベースに格納される信号点数が増え、データベースを 拡張しなければならない。しかし、六電極 BPM へ置き 換える度に、データベースに変更を加えるのは効率的 では無い。そこで、全ての BPM の信号を六電極対応に した。

制御系の上位から見ると、四電極 BPM または六電 極 BPM の如何に拘わらず、全て六電極対応のデータが VME 上のプロセスから送られる。四電極 BPM では対 応する信号が存在しない場合があるが、その場合はゼロ に相当する値が送られる。表4 は四電極から六電極へ 変更される信号の対応表である。

表 4: 四電極から六電極への信号名称変更

旧四電極対応		新六電極対応
Voltage1 [V]	\rightarrow	Voltage1 [V]
	\rightarrow	Voltage2 [V]
Voltage2 [V]	\rightarrow	Voltage3 [V]
Voltage3 [V]	\rightarrow	Voltage4 [V]
	\rightarrow	Voltage5 [V]
Voltage4 [V]	\rightarrow	Voltage6 [V]
$Posx (=P_1) [mm]$	\rightarrow	$Posx (=P_1) [mm]$
Posy (= Q_1) [mm]	\rightarrow	Posy (= Q_1) [mm]
	\rightarrow	$P_{g2} \ [\mathrm{mm}^2]$
Error (= Q_2) [mm ²]	\rightarrow	$Q_{g2} \ [\mathrm{mm}^2]$
	\rightarrow	$Q_{g3} \ [\mathrm{mm}^3]$
Average Voltage [V]	\rightarrow	Charge [nC]

7. 円形断面六電極 BPM のビーム試験

円形断面六電極 BPM は 2011 年 8 月に L4 ビーム輸送 系内に設置され、2011 年 12 月及び 2012 年 2 月にビー ム試験が行われた。不足する信号処理の系統は予備の四 回路 BPM 信号処理回路を充当した。制御系データ収集 系が六電極に未対応なため、現場近くに仮設のローカル なデータ収集系を構築した。BPM 信号処理回路のデジ タル出力は全て高インピーダンス系なので、信号を二分 岐することが可能である。BPM 信号処理回路からの信 号の一方はローカルなデータ収集系へ接続され、残りは 既存の制御系データ収集系へ接続された。既存の制御系 データ収集系へ接続した理由は、ビーム位置を測定し、 ビーム位置の自動補正を行っているためである。

ビーム試験の手法は、六電極 BPM より上流側の四極 電磁石励磁量を変化させ、六電極 BPM 出力電圧から計 算されたモーメントと隣接するスクリーンモニタのビー ムプロファイルから計算されたモーメントを比較した。 図6及び図7はスクリーンモニタで取得されたビーム プロファイル画像及びその等高線図である。



図 6: ビームプロファイル (画像データ)



図 7: ビームプロファイル (等高線図)

図 7 で示される様な画像データに於いて、各セルの 輝度分布を $I(x_i, y_j)$ とする。 x_i 及び y_j はスクリーン中 心から各セルへの座標とする。n次絶対モーメントを計 算するために、直交座標系でのn次モーメント $m_{n(l-n)}$ を式 (4)の様に定義する。n次絶対モーメントは式 (5) から得られる。

$$m_{00} = \sum_{i} \sum_{j} I(x_{i}, y_{j}), m_{10} = \sum_{i} \sum_{j} x_{i} I(x_{i}, y_{j}),$$

$$m_{01} = \sum_{i} \sum_{j} y_{j} I(x_{i}, y_{j}), m_{20} = \sum_{i} \sum_{j} x_{i}^{2} I(x_{i}, y_{j}),$$

$$m_{11} = \sum_{i} \sum_{j} x_{i} y_{j} I(x_{i}, y_{j}), m_{02} = \sum_{i} \sum_{j} y_{j}^{2} I(x_{i}, y_{j}),$$

$$m_{21} = \sum_{i} \sum_{j} x_{i}^{2} y_{j} I(x_{i}, y_{j}), m_{03} = \sum_{i} \sum_{j} y_{j}^{3} I(x_{i}, y_{j}).$$
(4)

$$m_{00}P_1 = m_{10}, m_{00}Q_1 = m_{01},$$

$$m_{00}P_2 = m_{20} - m_{02}, m_{00}Q_2 = 2m_{11},$$

$$m_{00}Q_3 = 3m_{21} - m_{03}.$$
(5)

図 7 で示される画像データを式 (5) を用いて計算した結果、 $P_1 = 1.674 \text{ mm}, Q_1 = 0.651 \text{ mm}, P_2 = 1.987 \text{ mm}^2, Q_2 = 3.544 \text{ mm}^2 及び Q_3 = 11.448 \text{ mm}^3$ が得られた。ここで、モーメントの比較を行うのだが、 BPM のダクト (機械)中心とスクリーン中心が完全に一致していなければ絶対モーメントの比較は不可能である。しかしながら、相対モーメント(=ビームプロファイル重心からのモーメント)であれば、ビームプロファイルがほぼ同一なので比較可能となる。相対モーメント P_{g2}, Q_{g2} 及び Q_{g3} は絶対モーメントから式 (6) を使用して算出される^[5]。

$$P_{1} = b_{G} \cos \beta_{G}, Q_{1} = b_{G} \sin \beta_{G},$$

$$P_{g2} = a_{g2}^{2} \cos 2\alpha_{g2} = P_{2} - b_{G}^{2} \cos 2\beta_{G},$$

$$Q_{g2} = a_{g2}^{2} \sin 2\alpha_{g2} = Q_{2} - b_{G}^{2} \sin 2\beta_{G},$$

$$Q_{g3} = Q_{3} - b_{G}^{3} \sin 3\beta_{G} - 3b_{G}a_{g2}^{2} \sin(\beta_{G} + 2\alpha_{g2}).$$
(6)

図 7 で示される画像データを式 (6) を用いて計算した結果、 $P_{g2} = -0.391 \text{ mm}^2$ 、 $Q_{g2} = 1.366 \text{ mm}^2$ 及び $Q_{g3} = 0.161 \text{ mm}^3$ が得られた。相対二次モーメント Q_{g2} が大きな値を持つ理由は、ビームプロファイルが 45°方向に傾いているためである。

さて、2011 年 12 月のビーム試験で四極電磁石励磁量 を変化させ、ビームプロファイルを変化させながら相対 二次モーメントを測定したところ、相対二次モーメン トの変化分は BPM とスクリーンモニタでほぼ一致した が、絶対値は一致しなかった。調査の結果、各電極間の 減衰率が正しくなく、アンバランスな状態であることが 判明した。そこで、2012 年 1 月にケーブルやバンドパ スフィルター等の較正を行ったが、それでも無視できな い程度に電極間減衰率のアンバランスが残った。

そこで、実ビームを使用してアンバランスを解消す る手法を考案した。BPM の直上流にステアリング電磁 石が存在し、ステアリング電磁石と BPM 間はドリフト スペースである。このような配置で、ステアリング電磁 石の励磁量を変化させた場合、ビームがダクトや電極に 当たらなければ相対モーメントは変化しない。2012 年 2月のビーム試験では、ステアリング電磁石励磁量を変 化させても、相対モーメント Pg2、Qg2 及び Qg3 が変化 しないようなバランス係数(減衰率)を求めた。



図 8: ステアリング電磁石励磁量変化時の各モーメント

図8は2012年2月ビーム試験の時系列データ(参考) である。ステアリング電磁石励磁量を変化させても相対 モーメントが変化しない様な電極間バランス係数を入 力してある。

このビーム試験により得られた電極間バランス係数 を使用して、2011年12月のデータを再解析した。スク リーンモニタと BPM で得られた相対二次モーメントの 相関を示すグラフが図9及び図10である。残念ながら 同一ビームショットでのプロットでは無いため、ショッ ト毎のプロファイル変化がバラツキがとなって現れてい るが、原点を通り、ほぼ相関係数1を示している。これ が意味するのは、このタイプの BPM に於いて、理論的 な計算により規格化モーメントが正確に計算され、自己 完結的な実ビームによるバランス較正を行えば、正常に 動作させることが可能であることを示している。



図 9: 四極電磁石励磁量変化時のモーメント相関

8. まとめ

二次モーメント測定用の六電極 BPM 本体、六回路 BPM 信号処理回路及び 128 ビットディジタル入力ボー ドを開発した。開発した各機器は、空間的な占有スペー スは同じで、データ取得系統を4系統から1.5 倍の6系 統に拡張したものである。ハードウェア的には既存シス テムの系統拡張であるが、対数検波回路変更やサンプル



図 10: 四極電磁石励磁量変化時のモーメント相関

ホールド回路の廃止など、S/N を改善するための改良も 同時に行われた。六電極化に伴い、取得される信号数が 1.5 倍に増加するため、これを機会にデータを格納する データベースの拡張も行った。

円形断面六電極 BPM を L4 ビーム輸送系内に設置し、 実ビーム試験を行った。各電極間のバランス係数(減衰 率)の決定には、ビーム位置を変化させても相対モーメ ントが変化しない特性を利用した。四極電磁石励磁量 を変化させ、ビームプロファイルを変化させ、スクリー ンモニタと六電極 BPM から得られる相対二次モーメン トを比較した。相関は原点を通り、相関係数もほぼ1で あった。これは、このタイプ(ストリップライン型)の BPM では、理論的な計算のみで正確な規格化モーメン トが得られる事を示している。

参考文献

- R. H. Miller, et al., "Nonintercepting Emittance Monitor", Proc. 12th Int. Conf. High-Energy Accel. (HEAC'83), Fermilab USA, 1983, pp. 603-605.
- [2] K. Yanagida, et al., "Design of The Six-Electrode Circular Cross-Sectional BPM for Second-Order Moment Measurement", Proc. of the 8th Particle Accel. Soc. of Japan, Tsukuba, August 2011, pp. 446-450, http://www.pasj.jp /web_publish/pasj8/proceedings/poster/MOPS063.pdf.
- [3] K. Yanagida, et al., "A BPM System for the SPring-8 Linac", Proc. of the 20th Int. Linac Conf., Monterey USA, Aug. 2000, pp. 190-192, http://www.slac.stanford.edu/econf/C000821 /MOC17.pdf.
- [4] K. Yanagida, et al., "Beam Instrumentation Using BPM System of The SPring-8 Linac", Proc. of the 22th Int. Linac Conf., Lubeck Germany, Aug. 2004, pp. 438-440, http:// accelconf.web.cern.ch/accelconf/I04/PAPERS/TUP73.PDF.
- [5] K. Yanagida, et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 15, 012801 (2012), http://link.aps.org/doi/10.1103 /PhysRevSTAB.15.012801.
- [6] K. Yanagida, et al., "Signal Processor for SPring-8 Linac BPM", Proc. of the 5th European Workshop on Diagnostics and Beam Instr., Grenoble France, May 2001, pp. 162-164, http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/d01/papers/PM02.pdf.